BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-185628

(43)Date of publication of application: 13.08.1991

(51)Int_CL

611B 7/00

(21)Application number: 01-323369

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

13.12.1989

(72)Inventor:

ONO EIJI

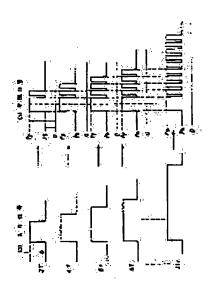
NISHIUCHI KENICHI ISHIBASHI KENZO YAMADA NOBORU AKAHIRA NOBUO

(54) RECORDING METHOD AND RECORDING DEVICE FOR OPTICAL INFORMATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a recording mark with little shape distortion by making the pulse width near the front wide in forming a recording mark at the same time as erasing the old signal for a recording method by a one-beam over write.

CONSTITUTION: When forming the recording mark which corresponds to a new signal while erasing the old signal at the time of signal recording, a digital signal with lengths which change discretely from 3T to 11T is shaped as a modulated signal (b), a laser beam is modulated based on this waveform, and the signal is recorded on an optical disk. That is, a bias power Pb for erasure always continually irradiates a recording track. When the recording mark is formed, only the leading pulse is made to be a pulse train with wider pulse width than the following pulses, and by a modulation signal which adds one pulse as the pulse width of the input signal becomes longer for just T amount, the laser is modulated between the bias power Pb and a peak power Pp and irradiates the recording track. Thus, the teardrop-shaped distortion of the recording mark can be reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A) 平3-185628

Solnt. CI. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)8月13日

G 11 B 7/00

7520-5D 7520-5D L

審査請求 未請求 請求項の数 19 (全17頁)

会発明の名称

光学情報の記録方法および記録装置

願 平1-323369 ②特

願 平1(1989)12月13日 御出

73発 明 者 大 72発 明 者 西 @発 明 者

野 鋭 内 健 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

石 榧 ②発 明 考 H 誰 \equiv 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

Ш 平 個発 明 夫 者 赤

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社內

创出 顋 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

砂代 理 弁理士 粟野 重 差 外1名

1. 発明の名称

光学情報の記録方法および記録装置

2. 特許請求の範囲

(1) レーザー光鉄等の照射によって、光学的 に識別可能な状態間で可逆的に変化する記録薄膜 を育する光学情報記録媒体上に、 パルス幅変調さ れたデジタル信号を一つのレーザースポットを用 いてオーバーライトする光学情報の記録方法にお いて、

古い記録マークの消去はレーザーパワーを消去 パワーレベルで一定に保って照射し、新しい記録 マーグの形成は一つの記録マークを形成するため の記録波形を複数のパルスからなる記録パルス列 にした後レーザーパワーを変調して行い、 前記記 輝パルス列の先頭のパルスあるいは2番目のパル スまたはその両方のパルスのパルス幅を残りの後 統パルス列中の各パルスのパルス幅より大きくか つ記録されるマーク長に関係なく一定とし、 煎記 後続パルス列中の各ペルスのパルス幅とパルス周

別はそれぞれ等しく、 かつ長さが n 番目の記録マ ークを形成する場合の前記後続パルス中のパルス 数はna+b個(a,bは定数であり、aは正の 整数、 bは整数)であることを特徴とする光学情 報の記録方法。

(2)レーザー光線等の照射によって、光学的 に識別可能な状態間で可逆的に変化する記録薄膜 を有する光学情報記録媒体上に、 パルス観変調さ れたデジタル低号を一つのレーザースポットを用 いてオーパーライトする光学情報の記録方法にお

古い記録マークの頂去はパルス幅とパルス周期 が一定の複数のパルスからなる消去パルス列によ りレーザー光を消去パワーレベルと再生パワーレ ベルあるいはパワーオフレベルの間で変調して行 い、 新しい記録マークの形成は一つの記録マーク を形成するための記録披形を複数のパルスからな る記録パルス列にした後レーザーパワーを変調し て行い、 前記記録パルス列の先頭のパルスあるい は2番目のパルスまたはその両方のパルスのパル

ス幅を残りの後継パルス列中の各パルスのパルス 幅より大きくかつ記録されるマーク長に関係なく 一定とし、前記後観パルス列中の各パルスのパル ス幅とパルス周期はそれぞれ等しく、かつ長さが れ番目の記録マークを形成する場合の前記後続パ ルス中のパルス数は1a+b個(a,bは定数で あり、aは正の整数、bは整数)であることを特 後とする光学情報の記録方法。

(3) 前記記録パルス列の先頭パルスのパルス 幅を前記後続パルス列中の各パルスのパルス幅よ り大きくすることを特徴とする請求項1または2 記載の光学情報の記録方法。

(4)前記パルス列の先頭から2番目のパルスのパルス幅を後継パルス列中の各パルスのパルス幅より大きくすることを特徴とする簡求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(5) a = 1, b = 0 であることを特徴とする 請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(8) a = 1. b = -1 であることを特徴とする請求項1 または2記載の光学情報の記録方法。

ただしる: 記録用光度の故長

1: 光ディスクと記録スポットの相対速度 を満たすことを特徴とする第求項1または2記載 の光学情報の記録方法。

(12)前記記録薄膜がアモルファスと結晶間で状態変化を起こす相変化型媒体であることを特徴とする請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(13) 前記博去パルス列中のパルス周期が前記後続パルス列中のパルス周期と同じであることを特徴とする請求項2記載の光学情報の記録方法。

(14) レーザー光線等の照射によって、光学的に識別可能な状態間で可逆的に変化する記録環 薬を育する光学情報記録媒体上に、パルス概変調 されたデジタル信号を一つのレーザースポットを 用いてオーバーライトする光学情報の記録装置に おいて、

古い記録マークの預去時には一定のパイテス電 流を半導体レーザーに流す手段を有し、かつ記録 マークの形成は一つの記録マークを複数のパルス (7)前記記録パルス列の変調は記録パワーレベルと前記消去パワーレベルとの間で行われることを特徴とする請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(8)前記記録パルス列の変調は記録パワーレベルと再生パワーレベルまたはパワーオフレベルとの間で行われることを特徴とする請求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(8) 前記記録パワーレベルから前記消去パワーレベルに移る場合、あるいは前記消去パワーレベルに移る場合、またはその双方の場合において、一旦前記再生レベルまたはパワーオフレベルを経ることを特徴とする 額求項1または2記載の光学情報の記録方法。

(10)前記後続パルス列中のパルスのパルス 幅が後続パルスの繰り返し周間の1/8以上1/ 2以下であることを特徴とする額求項1または2 記載の光学情報の記録方法。

(11)後続パルス列中の繰り返し周期 r が r ≤ λ / L

からない一ザーバルス列の照射により行う手段として、入力信号の最長のパルス幅に対応する記録パルス明のパターンをあらかじめ設定して対応すると、それ以下のパルス幅に対立で対応するために前記パターン設定器があるために前記があると、前記変調器からのパルス列を形成するための知からのパルス列を形成するの先頭からのパルス列を形成するのと型である光学情報の記録を配きますることを特徴とする光学情報の記録を配きます。

(15) レーザー光線等の照射によって、 光学的に 職別可能な状態間で可逆的に変化する記録薄膜を有する光学情報記録媒体上に、 パルス幅変調された信号を一つのレーザースポットを用いてオーバーライトする光学情報の記録装置において、

古い記録マークの消去時にはパルス幅とパルス 周期が一定の複数のパルスからなる消去パルス列 により半導体レーザーを変調する手段を有し、か つ記録マークの形成は一つの記録マークを複数の パルスからなるレーザーパルス列の照射により行

(18)入力信号パルスの立ち上がりを検出して前記設定記録パターンの発生を開始し、立ち下がりを検出して前記設定記録パターンの発生を終了させることにより、前記記録パルス列を作り出すことを特徴とする請求項14または15記載の光学情報の記録装置。

(17) 前記消去パルス列を作り出す手段が、 入力信号の最長のパルス間隔に対応する消去パルス列のパターンをあらかじめ設定しておくパターン設定器と、 それ以下のパルス間隔に対応する消去パルス列を形成するために前記パターン設定器

レーザー光線を利用して高密度な情報の再生あ るいは記録を行う技術は公知であり、主に光ディ スクとして実用化されている。 光ディスクは再生 専用型、追記型、書き換え型に大別することがで きる。 再生専用型には音楽情報を記録したコンパ クト・ディスク (以下CDと記す)、 あるいは面 依情報を記録したレーザー・ビデオ・ディスク (以下LVDと記す)等がある。 これらは光ディス ク上にあらかじめ信号が記録してあり、 ユーザー は音楽や映像の情報を再生することはできるが、 信号を記録することはできない。また、追記型は 基板上に記録膜として金属薄膜、Te合金、有機薄 護等を設け、 レーザー光線等の照射により記録度 に穴を調けたりあるいは凹凸を設ける等なんらか の変化を生じさせて信号を記録するものである。 さらに各換え型はレーザー光線等の照射条件を変 えることにより2つ以上の状態間で可逆的に変化 する記録薄膜を用いるものであり、 主なものとし て光磁気型と相変化型がある。光磁気型は記録簿 膜として強磁性薄膜を用い、 その磁区の方向を変

の設定抗去パターンの先頭から必要な長さを切り 出す変調器で構成されることを特徴とする請求項 15記載の光学情報の記録装置。

(18)入力信号パルスの立ち下がりを検出して前記設定消去パターンの発生を開始し、次の入力信号パルスの立ち上がりを検出して前記設定情去パターンの発生を終了させることにより、前記消去パルス列を作り出すことを特徴とする請求項17記載の光学情報の記録装置。

(19)前記変調器および前記パターン発生器は前記信号発生器と同一のクロック値号により作動を制御されることを特徴とする調求項14または15記載の光学情報の記録袋配。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、レーザー光線等を用いて高速かつ高 密度に光学的な情報を記録再生する光ディスクを 中心とした光学情報記録部材への信号の記録方法 および記録装置に関するものである。

従来の技術

化させることにより信号を記録する。 相変化型は記録薄膜として主にTe合金やSe合金を用いて、記録薄膜をアモルファスと結晶の間、 あるいは結晶とさらに異なる構造の結晶の間で状態変化させて信号を記録する。

また光ディスクの開発は最近では香換え型に主

眼が置かれつつあるが、 前記相変化型の光磁気型 に対するメリットの一つに、一つのレーザースポ ットにより古い信号を預しながら新しい信号を記 録すること、 いわゆる1ピームオーパーライトが 文品に実現できるということがある(特別昭 5 6 - 1 4 5 5 3 0 号公報)。 これは第21図のよう に、新しい信号を記録する場合にレーザーパワー を記録レベルと消去レベルの2つのパワー間で変 制することにより、古い信号を消去しながら新し い信号を記録するというものでる。 しかしながら この方法においても記録マークの反摘状歪が発生 する。これを解決する手段として特別昭63-2 8 8 8 3 2 号公银、特闆昭 8 3 - 2 7 9 4 3 1 号 公報、特閱平1-150230号公報、特別平1 - 253828号公報が提案されている。 特開昭 83-288832号公報、特開昭83-279 431号公報は一つの記録マークを形成するため の記憶波形を同一形状の短ペルスからなるパルス 列で構成することによって、 また特勝平1-15 0230号公報は一つの記録マークを形成するた

かった。

本発明は上記舞蹈を解決する記録方法及び記録装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために、本発明者らは特額 平1-170207号で提案した光学情報の記録 方法および装置をさらに改良して、 新だに非常に 簡単な装置構成により形状歪が小さい記録マーク を形成する1ビームオーバーライトによる記録方 法及び記録装置を開発した。

すなわち、光ディスク上にパルス幅変調された デッタル信号を一つのレーザースポットを用いて オーパーライトする場合に、古い記録マークの信 去はレーザーパワーを携去パワーレベルで一定に 保って風射し、新しい記録マークの形成は一つの 記録マークを形成するための記録波形を複数のパ ルスからなる記録パルス列にした後レーザーパワ ーを変 到して行い、 例記記録パルス列の先頭のパ ルスのパルス幅を残りの後続パルス列中の各パル めの記録被形を複数パルスからなるパルス列で構成し、かつそのパルス幅およびパルス間隔を様々に変化させることによって、さらに特開平1-253828号公報は記録波形のみならず消去光もパルス列状に変調し、かつ照射光パルスのデューティを徐々に小さくすることによって記録マークの形状歪を低減するということを提案している。

発明が解決しようとする課題

スのパルス幅より大きくかつ記録されるマーク長に関係なく一定とし、前記後続パルス列中の各パルスのパルス幅とパルス周期はそれぞれ等しく、かつ長さが n 番目の記録マークを形成する場合の前記後続パルス中のパルス数は n a + b 個(a, b は定数であり、 a は正の整数、 b は整数)とする。 なお本発明においては消去パワーレベルをさらにパルス変調してもよい。

 器の設定記録パターンの先頭から必要な長さを切り出す変調器と、前起変調器からのパルス列化された信号によって半導体レーザーの駆動電流を変調する手段を有する光学情報の記録装置より行う。

本発明のオーバーライトによる光学情報の記録 方法は、古い信号を充分に指去すると同時に、記録マークを形成する場合には先頭付近のバルス幅 が広いために記録膜の到達温度が先端でも充分高く記録マークの優情状の歪みを低減することができる。 そして本発明による光学情報の記録を置は、あらかじめ設定した一つあるいは二つの信号バターンから必要な全てのパターンを作り出すため、上記記録方法を非常に簡単な構成で実現するものである。

実施例

以下本発明を図面を参照しながら詳細に説明する。

本発明による光学情報の記録方法の最大の特徴は、信号記録時に古い信号を捐去しながら新しい

の到達温度を一定にするための手段を提案するも のであり、記録マークが終端ほど太くなり最適状 になる現象を防ごうとしている。しかし実際には、 1)記録マークが硬績状になるのを訪ぐ効果が小さ い、 2)記録装置が複雑になる、 等の問題があった。 そこで免明者らは、 記録マークの歪みを低減し、 かつ袋屋構成を複雑にしないオーバーライト方法 について詳細に検討した。 その結果記録マークの 尿族状の歪みを防ぐためには、 I)一つの記録マー クを形成するための信号パルスを複数の短パルス からなるパルス列状に変調し、2)そのパルス列の 先頭あるいは2番目のパルス幅をその後に続くパ ルスよりも広めて最適化するのが効果的であるこ とがわかった。次に簡単な装置模成で実現するた めには、1)記録時のピークパワーは一定に保ち、 到達温度の制御はパルス幅を変化させて行う。4) 個母 パルスをパルス列化する場合、 信号パルスの パルス幅とパルス列に含まれるパルス数が一定の 関係を保つようにする。 例えば信号パルスのパル ス幅が一つ長くなったら、パルス列に含まれる短

信号に対応する記録マークを形成するときに、第2回(a)の様に長さが倒えば37から117をで難散的に変化するデジタル信号を記録する場合(b)のように整形し、この彼形を元にレーザー光をさらに第1回(b)のように変調して光ディスク上に信号を記録することにある。最初にレーザー光を第1回(b)のように変調する理由について述べる。

(b)においてPbは有去パワーレベルであり、レーザーパワーをこのレベルで一定に保つことにより エモルファス部分は結晶化される、つまり古い信号は損去される。

また、新しい信号を記録する場合、つまり新しい信号を記録する場合はレーザーパワーを記録パワーレベルPpまで高めてかつパルス変異して行う。ヒートモード記録で第21図(a)のような信号を記録する場合、信号放形で直接レーザー光の日本を生ずるため、自述のように様なマークの歪を生ずるため、これらの方法はレーザー光の日射部分の熱を制御し記録マークの全体

パルス数を一つ増やす、 5)追加する短パルスのパ ルス幅は常に一定とすることが必要である。

また、第2図(b)の変調波形を第3図(b)および(c)の様な変調波形としてもよい。 つまり記録マーク形成時にレーザーパワーをピークパワーレベル

Ppと再生パワーレベルPrあるいはパワーオフレベル(Oレベル)の間で変調する。この場合短パルスで照射された後急冷されるため、アモルファスの記録マークが形成しやすくなる。また(e)においては消去パワーレベルPbから記録パワーレベルPpに移る場合と、逆に記録パワーレベルPpから消去パワーレベルPbに移る場合に再生パワーレベルPr(パワーオフでもよい)を経ている。このため記録マークの先端と終端での温度変化が急激になり時品とアモルファスの境界、すなわち記録マークのエッヂ位置が明確になる。

さらに本発明による異なる態様の記録方式として第4図(b)および(c)のレーザーパワーの変調方式を提案する。 これらは消去レーザー光も、 簡単な装置構成で実現するという条件の基にパルス変調するものである。

情去レーザー光もパルス変調することのメリットを第5回を用いて説明する。 第5回(a)は消去レーザー光を変調しない場合、(c)は変調する場合の1ビームオーバーライトによる記録方式であり、

いくのを小さくすることができる。 なお、この記録方法は第3図(c)の方法よりも記録マークの終端においてPrとなる時間を長くできる、 すなわち急冷にできるというメリットがある。

これまでに記述した記録方法は、すべて簡単な 構成の記録装置によって実現できることを前提に したものであり、以下に本発明による具体的な記録装置の構成について説明する。

第8図に第1図(b)の放形を得るための本発明による光学情報の記録装置のブロック図を示す。 信号 配録期間中、 すなわち記録ゲート信号 取が入力されるときには半導体レーザーにはペイアスパワー (つまり情まパワー) Pbを得るためのパイアス電流 lbが放れる。 そして記録マークを形成四級ときには信号発生器 1 からの記録録信号 51を変異器 2 で加工した 54によりスイッチ 4 を作動させて、 lbに laを重量し、 光学へッチ 5 に 組み込まれている半導体レーザーを駆動している光がイスクア上に照射する。 本銭便の最大の

(b),(d)はそれぞれの記録方式に対応する記録数の 到速爆度を示してある。 記録膜は塞爆Toより高い 結晶化塩度Tx以上に保たれることによりアモルフ ァス部分が結晶化し、 酸点TB以上に昇温されるこ とにより倍融後急冷されてアモルファス化する。 この場合重要なことは 1) 記録マーク形成時およ び消去時には記録膜の到達程度を一定に保つこと、 2) 記録から消去、および消去から記録に移ると きには温度変化を短時間で終了することである。 1)により記録マークの形状歪を小さくし、かつ 古い信号が消去される割合を一定に保ち、2)に より記録マークの先週と終婚のエッグ位置を明確 にして再生波形のジョタを小さくすることができ る(特に終端で急冷してエックを明確にすること が重要)。 消去レーザー光をパルス変調すること により、 頂去パワーレベル Pbから記録パワーレベ ルPpに移る場合と、逆に記録パワーレベルPpから **梢去パワーレベルPbに移る場合に再生パワーレベ** ルPr(パワーオフでもよい)を容易に設けること ができ、かつ侑去時に到達鼠度が徐々に上昇して

特徴は、信号siをs4に加工する変調方法にある。 記録する信号SIは信号発生器1から最初に変調器 2に入力される。 この信号はパルス幅変萌(PW M)されたデジタル信号であり、従来は一般的に この信号そのものでレーザーを駆動し記録してい た。しかし本発明における変調器は入力信号中の 各パルスをさらにパルス列化する。変調方法は、 入力信号S1に含まれる最長のパルス幅に対応する 変調パターンをパターン設定器3に予め設定して おく。 変調器2はsl中のパルス幅を検知し、 その 長さに応じてパターン設定器3の設定パナーンの 先頭から必要な長さを切り出してパルス列を発生 して変調器から出力し、スイッチ4を作動させる。 したがって入力信号に含まれる異なるパルス幅の パルスに対して、一つのパターンを設定しておく だけですべてのパターンをパルス列化することが できる。さらに設定するパターンの形状を、 再生 故形面みが母小になるように最適化することも容 曷にできる。 なお信号発生器からの入力信号のエ ッジ位置がパルス列に変調されることによって変

動しないように、入力信号の発生器、変調器、パターン設定器を同一のクロックCI(入力信号のクロックの整数倍の周波数のクロックが良い)で同期させて記録信号のジッタを抑えるのがよい。

第6図における変調器2とパターン設定器3は 以後簡単のためにマルチパルス回路(MP回路と 記す)と呼ぶ。

第8図における基準電圧設定回路8は記録ゲート信号での入力されたとき lbと laを得るのに必要な電圧を発生するものである。 またでがオフのときは半導体レーザーは再生パワーPrで発光しており、このとき電流 lrが流れている。

きらに変調器2の具体的構成を第7図に示す。 立ち上り検出器は入力信号siのパルスの立ち上が りのエッグ位置を検出し、パターン発生器12に 起動信号を送る。パターン発生器はこの起動を によりパターン設定器3に設定されたパルステップ によりパターンを呼び出した後、先頭から1ステップ で変異信号として送出を開始する。その後、立 ち下がり検出器10により入力信号siのパルスの

光ディスクに信号が書き込まれる。 光ディスクは 第9図の構造の書き換え可能な相変化型を用いた。 光ディスク基板21はあらかじめ信号記録トラッ クの形成してある 5"のポリカーポネイト基板を使 用した。 起録膜23はTeGeSb系材料で、膜厚は40 OAとした。 また記録膜の上下にZaSからなる保護度 22を設けさらにレーザー光の入射と反対側にAu の反射膜24を設けてある。 そしてこれらの薄膜 を保護するためのパックカパー28を設けた。 信 号の記録状態と消去状態は記録膜のアモルファス 状態と結晶状態にそれぞれ対応する。 信号の記録 実験では、 記録トラックにあらかじめ信号を記録 しておき、その上に1ピームオーパーライトによ り古い信号を削去しながら新しい信号を記録した。 また光ディスクと収束させたレーザー光の記録ス ポットの相対速度は1.25m/secとした。 記録された 信号の評価は、 再生した信号のジッタを測定する ことによりおこなった。 ジッタは、 再生放形のゼ ロクロスを判定レベルとして、 あるゼロクロスか ら次のゼロクロスまでの時間をパルス幅の異なる

立ち下がりのエッツ位置を検出し、停止信号をパターン発生器3に送る。パターン発生器はこのの発止信号により設定パターン、つまり変調信号の免免にな中止し、次の入力信号パルスを待つ。し変調信号のかがのようにがいターン発生器から常に送下がり検出器10、立ち下がり検出器10、立ち下がり検出器10、はする変調信号のジッタを抑えることができる。

次に本発明の具体的実施例を記す。

(実施例1)

第8図に本実施例に用いたMP回路のブロック図を示す。入力信号 85としては音楽再生用のCDに用いられている BFM(8-14変調)信号を使用した。 EFM は31から11Tまでのパルス幅の異なる9 種類のパルスにより構成された PW M信号である。ここで7はクロックの周期であり、 T=230nsecである。 変調されたパルス列信号 512は第8図と同様にスイッチ 4 を作動させてレーザーを駆動し、

3 種類のパルスごとに繰り返し測定し、 その標準 個差をもって定差した。 ここで第8 図のMP 回路 の動作原理を第10 図のタイミング図を参照しな がら説明する。

この回路は、 最長のパルス幅117に対応し44の領 埃からなるパルス列をあらかじめパターン設定器 18に設定しておき、入力される3TからLITのパル スのパルス幅に対応して、 設定されたパナーンの 先頭から必要な長さのパルス列を作り出しレーザ 一駆動回路へ送出するものである。 つまり、EF M 信号 55のクロック 周期 Tを 4 分割した T/4がこの 国路系のクロックC2である。 なお第10図のタイ ミング図はITのパルスをパルス列化する場合につ いて示している。 まずEFM倡号55が入力される とデータフリップフロップのDFF13とDFF 1 4 およびNAND15により起動信号54が作ら れ、 パラレルイン/シリアルアウトシフトレジス タ: PS/SR17が始動する。PS/SR17 はパターン設定器18から設定パターンを呼び出 し、クロックC2に同期して1ステップゴつ送り出

特閒平3-185628 (8)

す。パターンの設定方法としては、最長のパルス 幅117に対応する44ステップのそれぞれに対してス イッチSW1~SW44を設けることにより行い、 そのため各スイッチのオン・オフにより任意パタ ーンの設定が可能である。 次にDFF13、DF F 1 4、 N A N D 1 B により停止信号510が作られ るが、47のパルスの場合16番目のクロックに同期 した停止信号SIOが出力される。 この停止信号によ りPS/SR17からの17ステップ以降の出力は 停止し、結局S12のようなパルス列が得られる。な おDFF20はパルス列とクロックを再び同期さ せてリッタを低級させた後、 パルス列をレーザー 区動回路へ送出するものである。 このようにして 37~117のすべてのパルスを設定パターンの形状で パルス列化することができる。 この装置により、 設定パターンとして第2図(b)のIIIの場合の変調 放形を用い、EFM信号をこのパターンにしたが ってパルス列化しレーザーを変調して、 信号をオ ーパーライトした後、 再生して再生信号のジッタ を測定した。 オーパーライトのパイアスパワーPb

ターンとジッタの関係を求めた。 入力信号、光ディスク、光ディスクと記録スポットの相対速度、パイアスパワー、ジッタの測定方法は実施例 1 と同じである。 設定したパターンの形状を第 1 2 図に、またそれぞれの波形で記録した後再生した信号において測定したジッタの値を第 1 表に示す。ジッタは記録ビークパワーを変化させたときの最小値であり、その時の記録ビークパワーも第 1 表に示す。

(以下余白)

は4mlとした。 第11図に記録ピークパワーPp(光 ディスクの盤面上での値)とジッタの関係を示す。 第11図には、 従来の一般的記録方法であるEF M低号で直接レーザーを変調して信号をオーバー ライトした場合のジッタの測定結果を比較のため に示した。 第11図から明らかなように、本発明 による記録方法および記録装置によれば、記録マ ークの彼形歪みが小さくなるため再生被形のジッ タも小さくなり、したがって再生信号のエラーレ ートを低減できると共に記録密度の向上が図れる。 なお節8因ではパターン設定はスイッチST1~ST4 4のオン・オフにより行ったが、 パターン設定器と してあらかじめ設定パターンを記録したROM(再生専用メモリ)としてもよい。 ROMを使用す ればこの回路は遅延素子等を含んでいないため、 集積化することができ、 装置の小型化が可能とな

(実施例2)

次に実施例1で示した装置を用いて、パターン 設定部に設定する放形を種々変化させて、 設定パ

第1安

19-7	ジッタ(ASec)	記録ビークパワー(mT)
(m)	5 0	7. 0
(b)	6 0	8. 3
· (c)	6 0	10.0
(4)	7 0	8. 5
(e)	6 0	6.8
(f)	4 0	. 6. 8
'(g)	4 0	8. 9
(A)	105	8. 3
(1)	6 5	6. 9
(1)	4 0	7. 0
(k)	1 3 0	7. 3
(1)	1 8 0	8. 3
(m)	4 0	7. 3
(n)	3 5	.8. €
(0)	3 5	10.5

第1表から分かるようにパターン(h),(k),(l)を 餘いてはジッタはi00msec以下と小さくなっている。 パターン(h),(k)と(l)は本発明に対する比較例で ある。 パターン(l)はEFM信号そのものでレーザ ーを駆動する方法と等価であり大きなジッタを示 している。 またパターン(k)は、 パルス幅の等しい 短パルスを等間隔で並べたパルス列で記録するも のであり、 パターン(1)の場合よりは改善されてい るものの大きなジッタを持つ。これは先頭部分に おいて温度が急激に立ち上がっていないため記録 マークの先頭部分が細くなっているためと考えら れる。 またパターン(b)においてもクッタが大きく なっている。いずれにしても、請求項1に記載の 条件を摘たせばジッタを小さく抑えられることが わかる。 特にパターが(a),(f),(g),(j),(m),(n), (o)であるときジッタは50msac以下となる。 これら の特徴は、先頭もしくは2番目のパルス幅を大き くし、後続パルスは同じパルス幅とパルス間隔で あり、かつ記録マーク長が一つ長くなればパルス が一つ追加されるように後続パルスの周期をTとし

ディスク、 ジッタの測定方法は実施例1と同じで ある。再生した信号において測定したジッタの値 と相対速度の関係を第13図に示す。 ジッタは記 録ピークパワーおよびパイアスパワーを変化させ て母小値を求め、その値を記した。 パターン(g), (d)共に相対速度が速いところでジッタが増大した。 ジッタの増大はパターン(d)より(g)の方が相対速 度の遅いところでおきており、 その点は後続パル スの繰り返し周期 [パターン(g)ではT=238nsec,(d)ではT/2=115nsec] が λ/L (λ は レー ザー の 波 長 で本実施例では0.83μm、 Lは相対速度)より大き くなるあたりと一致する。 これはレーザー光を間 欠的に照射することによる記録マークに生じる歪 みが、レーザー光の波長オーダーの大きさとなり 光学的に再生されるため、結果として再生被形の 歪みを生じジッタが増加するものと考えられる。 したがって

r ≦ l /L

τ: 後続パルスの繰り返し周期

え: レーザーの放長

ていることである。 なお、 (a),(f),(g),(j),(n),

またパターン(n),(o)の場合に見られるように後続パルスのパルス幅が短くなると、各パルスで脳 耐後の冷却速度が大きくなりジッタが小さくなる。 本実験で用いたMP回路は117の信号パルスを44分 割しているが、さらに細かく88分割すれば後続パルスのパルス幅をT/8にできる。しかしそれ以上細 かく分割しようとするとMP回路のクロック周放 数が高くなりすぎて回路設計が困難になる。つま り第1皮の結果および回路設計の容易さを考慮す れば、後続パルスのパルス幅はT/8以上T/2以下に するのが良いと考えられる。

(実施例3)

さらに実施例1及び2と同じ装置で、パターン設定部に実施例2の(d)および(g)のパターンを設定し、光ディスクと記録スポットの相対速度を変化させながらソッタの値を求めた。入力信号、光

L : 光ディスクと記録スポットの相対速度 を満たすように後続パルスの繰り返し周期を設定 した方が良い。

上記実施例 1 ~ 3 ではパルス列は第 1 図 (b)のようにパイアスパワーレベル Pbとピークパワーレベル Ppの間で変調したが、次に第 3 図 (b),(c)のようにピークパワーレベルと再生パワーレベル Prの間で変調する記録装置について説明する。

第14図にその構成を示す。 信号発生器 1 からの B F M 信号 s5 は第8図と同様の M P 回路 2 1 に入力され、 パルス列状に変調されて信号 s12として出力されるイッチ 2 4 を作動させる。 同時に第8図における D F F 1 4 の Q から信号 s13を取り出しD F F 2 2 で位相の 調整を行った後、 インパーター 2 3 を介して信号 s14を作りスイッチ 2 5 を作動させる。 これにより入力信号 s5が第15図 (a)のような放形の場合、 s12、 s14はそれぞれ(b)、 (c)のようになる。 すなわち、 記録マークを形成するときにはパイアス電流 1 bは流れないため、 半導体レーザーはピークパワー Pp と再生パワー Prの簡で変

第2表

パターン ジッタ(nsec) 記録ピークパワー(sft)

 (a)
 45
 8.3

 (f)
 35
 8.0

 (a)
 30
 8.6

この結果は第1要におけるそれぞれの彼形に対応するジッタよりも小さい。 これは記録マーク形成のとき、 短パルス 照射後の冷却速度が大きいため アモルファス化し 島く、 大きな記録マークが得られるためと考えられる。 特に放形(m)の場合においてジッタの低減効果が大きい。 これはパイアスパワーPbからピークパワーPP移る場合に一旦再生パワーレベルPrを経るため、記録マークの前後において記録膜温度の変化が急峻になり、記録マークのエッジ位置が明確になったためと考えられ

実施例1~4では消去は一定のパイアスパワー

録ゲート信号TEが入力されたときにはIrが流れないように基準電圧設定回路32を設定しておけば記録パルス列はPpとパワーオフの間で、また消去パルス列はPbとパワーオフの間で変調される。次にこの記録装置を用いた詳細な実施例を示す。

(実施例5)

設定記録パターンとして第12回の(a)。(f)。(■))を用いた。入力信号、光ディスク、光ディスクと 記録スポットの相対速度、 ジッタの関定方法は実 版例2と同じである。 また相去パルス列のパワー Pbは 4. 5 mlとした。 それぞれの被形で記録した 後再生した信号において刻定したジッタの値を第 3 表に示す。 ジッタは記録ピークパワーを変化さ せたときの最小値であり、 その時の記録ピークパワーも第3 表に示す。

(以下余白)

関される。 また抗去領域ではバイアスパワーPbに保たれるため古い記録マークは結晶化される。 なお、記録ゲート信号Tsが入力されたときには1rが流れないように基準電圧設定回路26を設定しておけば記録パルス列はピークパワーPpとパワーオフの間で変調される。 次にこの記録装置を用いた詳細な実施例を示す。

, (実施例4)

(以下余白)

で照射して行う記録方法および装置について説明 してが、 次に消去パワーも 第 4 図 (b).(c)のように パルス変調する場合について説明する。

第18図に第4図(b)の様な波形を得るための記 録装置の構成を示す。 信号発生器 1 からのEFM 信号s5は第8図と同様のMP回路A27に入力さ れ、パルス列状に変調されて信号s12として出力さ れスイッチ30を作動させる。 同時に信号55はイ ンパーター29を介してMP回路B28にも入力 される。.MP回路BはMP回路Aとまったく同じ であり、これは指去レーザー光をパルス変類する ためのものである。 M.P.回路Bのパターン設定器 に列えば第17図(a)の放形を設定して(b)のよう な信号を入力したとき、MP回路Aからは記録マ ークを形成するためのパルス列(c)が出力され、同 時にMP回路Bからは消去パワーを変調するため のパルス列(d)が出力される。 従って半導体レーザ -の出力は第4図(b)のように記録マークを形成す るときにはPrとPpの間で変調され、消去のときに はPrとPbの間で変調されることになる。なお、記

第3表

パターン ジェタ(nsec) 記録ピークパワー(mf)

(a)	4 0	8.	4
(r)	2 5	8.	0
(m)	2 0	в.	7

従って半導体レーザーの出力は第4図(c)のように記録マークを形成するときにはPbとPpの間で変調されることになる。 なお、配録ゲート信号Tgが入力されたときにはIrが流れないように基準電圧設定回路34を設定しておけば指去パルス列はPbとパワーオフの間で変調される。次にこの記録装置を用いた詳細な実施例を示す。

(実施例6).

設定記録パターンとして第12図の(a)。(f)。(m)を用いた。 入力信号、光ディスク、光ディスクと記録スポットの相対速度、 ジッタの測定方法は実施例2と同じである。 また慎去パルス列のパワーPbは 4. 5mmをした。 それぞれの故形で記録した後再生した信号において測定したジッタの値を第4数に示す。 ジッタは記録ピークパワーを変化させたときの最小値であり、 その時の記録ピークパワーも第4表に示す。

的であることが分かった。

また、消去パルス列中のパルス周期は記録パルス列中の後続パルスのパルス周期と同じにしておけば、本実施例のようにMP回路AとMP回路Bを同じ構成にでき都合がよい。

次に第18図に第4図(c)の様な放形を得るための記録装置の構成を示す。 信号発生器1からの8FM信号s5は第8図と同様のMP回路A27に入力され、バルス列状に変調されて信号s1をして出力され、イルチ30を作動させる。 同時に信号s5はインバーター28を介してMP回路B28に入力された後、再びインバーター33を経て信号s1をとなり、スイッチ31を作動させる。MP回路BはMP回路Aとまったく同じであり、これは情去レーザー光をパルス変調するためのものである。MP回路Bのバターン設定器に例えば第19図(a)の放形を設定して(b)のような信号を入力したとき、MP回路Aからは記録マークを形成するためのパルス列として例えば第17図(c)が出力され、同時にMP回路Bからは第19図(c)が出力される。

第 4 表

パターン ジッタ(asec) 記録ピークパワー(ml)

(a)	4 0	7. 2
(f)	3 0	6. 9
(m)	· 25	7. 4

この結果は第3表に比較レジッタが若干大きくなるが、記録ピークパワーを小さく抑えることができる。これは記録パルス列にパイアスパワーPbが存在するためである。

発明の効果

本発明の光学情報の記録方法および記録装置によれば、非常に簡単な装置構成により、オーバーライトのときに古い信号を消去しながら、新しい信号をジッタを小さく押えながら記録することができる。 これは光ディスクのエラーレートの低減につながり、 しいては光ディスクの記録容量の拡大をはかることができる。

4. 図面の簡単な説明

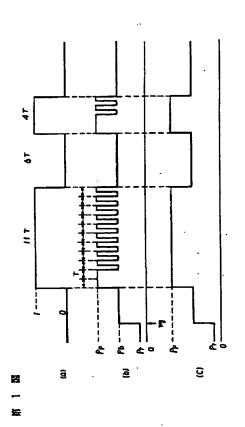
特閒平3-185628 (12)

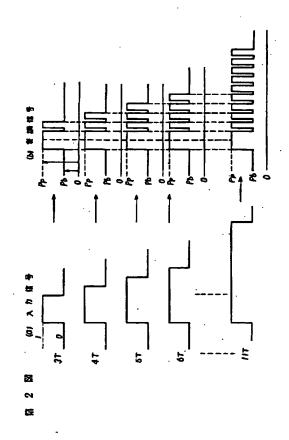
第1 図、第2 図、第3 図、第4 図は本発明の説明のための記録被形図、第5 図は記録被形と記録膜の到達温度の関係図、第6 図、第7 図、第8 図は本発明による光学情報の記録装置の構成図、第9 図は信号を記録した光ディスクの断面図、第10 図は第8 図の回路における信号の流れを説明するためのタイミング図、第11 図はグッタと記録ピークパワーの関係図、第12 図はパターン設定器に設定された記録パターン図、第13 図はソッタと相対速度の関係図、第15 図、第18 図の回路の機能の説明図、第20図、第21図は従来例による記録方法の説明図である。

1 • • • 信号発生器、 2 • • • 変異器、 3 • • • パターン設定器、 5 • • ・光学ヘッド、 8 • • ・スピンドルモータ、 7 • • • 光ディスク、 13, 14, 20, 22 • • • データフリップフロップ、 18, 23, 29, 33 • • • インペーター、 15, 18 • • • NAND回路、 17 • • • パラレ

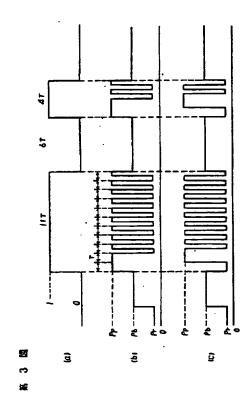
ルインシリアルアウトシフトレジスタ、18・・・パターン設定器、21, 27, 28・・・マルチパルス回路。

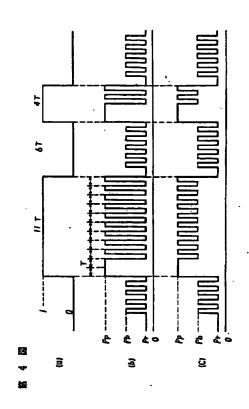
代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

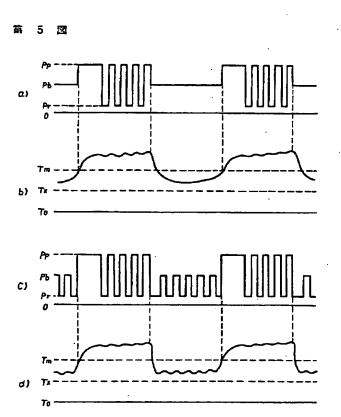


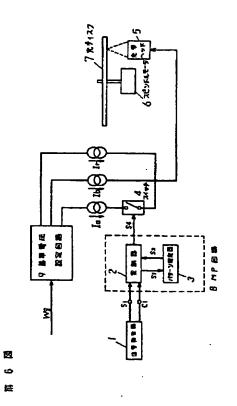


特周平3-185628 (13)

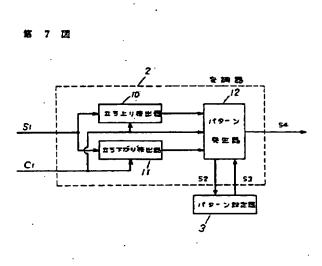


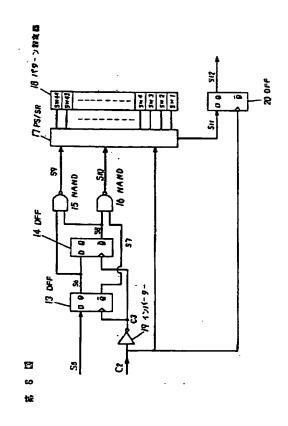




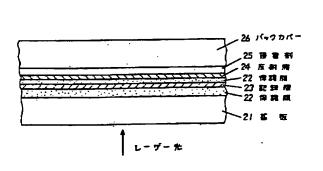


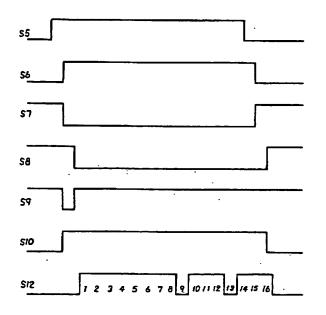
转開平3-185628 (14)





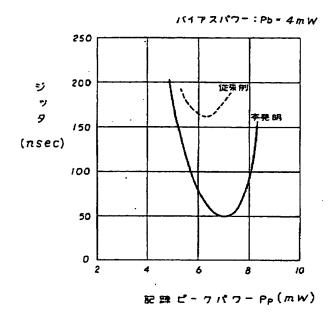
第10図



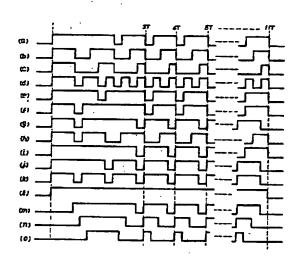


转聞平3-185628 (15)

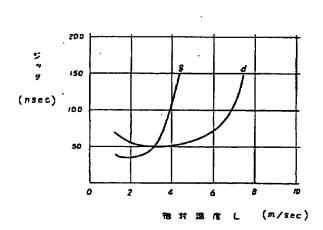
第 1 1 図

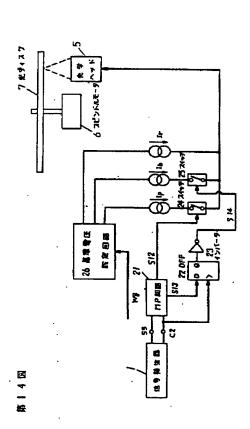




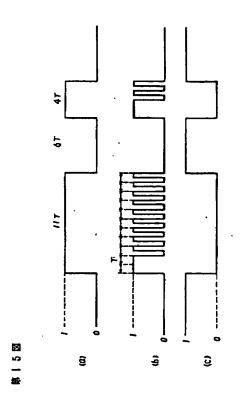


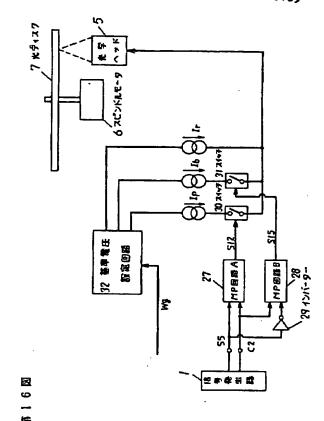
第13図

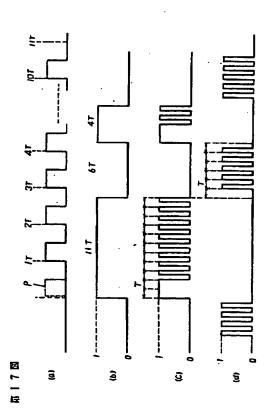


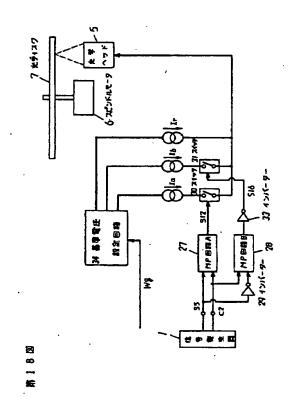


特閒平3-185628 (16)

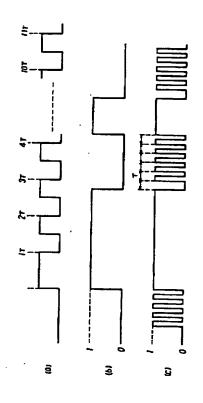


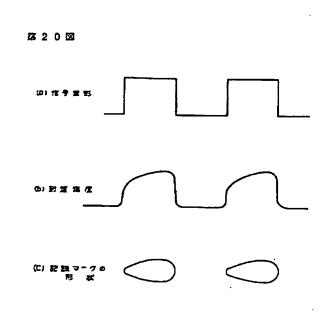




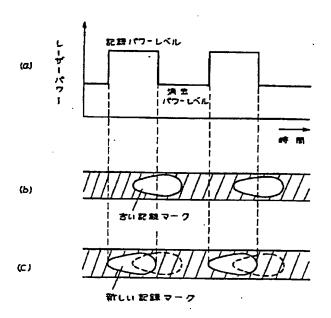


持開平3-185628 (17)





第21図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.